

## 半導体デバイス評価

- 1 . pn 接合ダイオードの評価の仕方と得られる情報
  - 容量 電圧特性
  - 電流 電圧特性
- 2 . 半導体の抵抗率の測定方法
- 3 . ホール効果測定 of 原理と得られる情報
  - 多数キャリア密度の温度依存性から得られる情報
  - 移動度の温度依存性から得られる情報
- 4 . 過渡容量測定 of 原理と得られる情報
- 5 . 過渡電流測定 of 原理と得られる情報
- 6 . 二次イオン質量分析法 of 原理と得られる情報
- 7 . オージェ電子分光法 of 原理と得られる情報
- 8 . EPMA の原理と得られる情報
- 9 . 光電子分光法 ( XPS、UPS ) の原理と得られる情報
- 10 . X 線回折法 ( XRD ) の原理と得られる情報
- 11 . 光の透過、反射、吸収による得られる情報
  - 基礎吸収、赤外吸収
- 12 . フォトルミネッセンス of 原理と得られる情報